

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

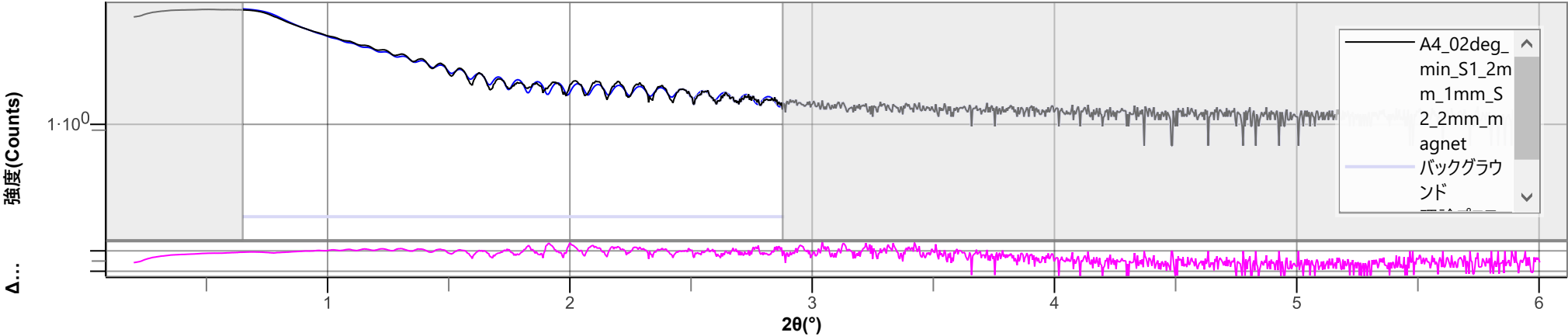
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.428 Const ±0.016 精密化	1.93634 Const ±0.04 精密化	0.100 Con... ±0.03 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe2O3	2.181 Const ±1.9 精密化	4.95000 Const ±0.05 ー最大 精密化	0.000 Con... ±0.1 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	93.502 Const ±0.08 精密化	8.06116 Const ±0.03 精密化	0.866 Con... ±0.011 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	0.000 Const ±0.15 最小ー 精密化	3.93700 Const ±0.09 最小ー 精密化	1.186 Con... ±0.02 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	